

01;05;10

Потенциал плоскостного каналирования в тяжелых ионных кристаллах

© Н.Э. Бабаджанян, Н.А. Корхмазян, Н.Н. Корхмазян

Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна,
375010 Ереван, Армения
e-mail: Natan-k@inbox.ru

(Поступило в Редакцию 2 июня 2006 г.)

Исследован потенциал плоскостного каналирования в тяжелых кристаллах типа KCl, имеющих конечные размеры.

PACS: 12.39.Pn

Метод расчета эффективных потенциалов каналирования, предложенный в работах [1,2], предполагает разложение функции Грина в ряд по векторам обратной решетки кристалла и дальнейшее усреднение потенциала вдоль плоскостей (осей) канала. Однако как сама задача, так и полученные выражения для потенциалов с математической точки зрения оказываются весьма сложными. По этому методу в работе [3] было исследовано осевое каналирование быстрых позитронов в канале Cl^- кристалла CsCl. Более простой метод расчета плоскостного каналирования вдоль заряженных плоскостей (111); ($\bar{1}\bar{1}\bar{1}$) ионного кристалла LiH предложен в [4]. Аналогичный метод расчета был развит также в работе [5], где исследован потенциал плоскостного каналирования в тяжелых ионных кристаллах KCl и CsCl. Во всех отмеченных работах задача решена для бесконечных кристаллов. Однако бесконечность размеров кристалла часто наводит на ложный путь. В связи с этим в работах [6–8] нами исследовано поведение потенциалов в легких кристаллах LiH и LiD, имеющих конечные размеры. К сожалению, ошибка, связанная с использованием модели бесконечного кристалла, имеется также в работе [5]. Эта ошибка настолько тонко „замаскирована“, что ее практически нельзя обнаружить, не изучив заранее случай конечных кристаллов. В настоящей работе исследуется поведение потенциала плоскостного каналирования в тяжелых ионных кристаллах, имеющих конечные размеры.

Плоский канал, ограниченный плоскостями $z = 0$ и $z = d_z$, изображен на рис. 1, где d_z — ширина канала. Предполагается, что каналированная частица пролетает вдоль оси x . Ввиду симметрии задачи потенциал вычисляется в полуканале $0 \leq z \leq d_z/2$. При расчете этого потенциала, как и в [6,7], облачная структура иона учитывается лишь для двух базисных ионов (Cl^- и K^+), расположенных на плоскостях $z = 0$ и $z = d_z/2$. Все остальные ионы считаются точечными зарядами, расположенными в остальных узлах кристаллической решетки. Ячейка усреднения потенциала (рис. 1) имеет форму квадрата $d_0 \times d_0$, где $d_0 = 3^{1/4}d/2$, а d — постоянная решетки. Потенциал отрицательной подрешетки

в произвольной точке $\mathbf{r}(x, y, z)$ квадрата определяется формулой

$$\varphi_{tot}^- = \frac{eZ^-}{|\mathbf{r}|} + \varphi_{el}^- - e \sum_{\mathbf{L} \neq 0} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{L}|}, \quad (1)$$

где Z^- — число протонов в ядре иона, φ_{el}^- — поле электронного облака базисного иона, а $\mathbf{L} = (ld_0, md_0, nd_z)$, $l, m, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Потенциал положительной подрешетки получится из (1), если в ней произвести замену $z \Rightarrow (z - 1/2)$, изменить знак перед суммой и характеризующие ион параметры заменить на соответствующие параметры для положительных ионов. Для расчета слагаемого φ_{el}^- воспользуемся моделью Иенсена–Ленца [9] для плотности электронного облака иона

$$\rho = -e \frac{N}{A} \frac{e^{-x}}{x^3} (1 + Cx)^3; \quad (2)$$

$$x \equiv \sqrt{\alpha r}; \quad \alpha \equiv \xi Z^{1/3}/a_0,$$

где N и Z — числа электронов и протонов в ионе, C и ξ — вариационные параметры, $a_0 = 0.528 \text{ \AA}$ радиус

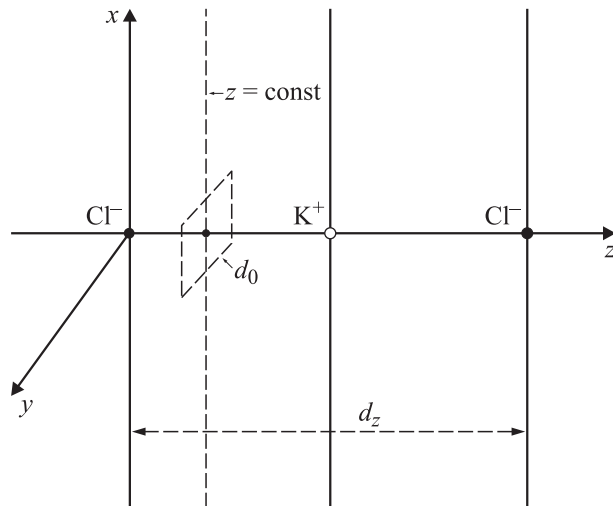


Рис. 1. Выбранный канал и плоскость $z = \text{const}$, на которой определяется усредненный потенциал.

Бора, $e = |e|$, и $r = |\mathbf{r}|$. Число A находится из условия нормировки функции (2)

$$\int_0^{\infty} \rho 4\pi r^2 dr = -eN,$$

что дает

$$A = \frac{8\pi a_0^3}{\xi^3 z} P_c;$$

$$P_c = 120C^3 + 72C^2 + 18C + 2. \quad (3)$$

Поступив в дальнейшем аналогично работе [5] и воспользовавшись очевидным соотношением

$$\frac{eZ^{\pm} - eN^{\pm}}{|\mathbf{r}|} = \pm \frac{2}{\mathbf{r}},$$

вместо (1) получим

$$\begin{aligned} \varphi_{tot}^{-}(\mathbf{r}) &= \frac{2eN^{-}\alpha^{-}}{P_c^{-}} F^{-}(r) - \sum_{l,m,n} \frac{e}{|\mathbf{r}-\mathbf{L}|}, \\ \varphi_{tot}^{-}(\mathbf{r}) &= \frac{2eN^{+}\alpha^{+}}{P_c^{+}} F^{+}|\mathbf{r}-\mathbf{\Delta}| + \sum_{l,m,n} \frac{e}{|\mathbf{r}-\mathbf{L}-\mathbf{\Delta}|}, \end{aligned} \quad (4)$$

где $\mathbf{\Delta}$ — вектор вдоль оси z , с модулем $|\mathbf{\Delta}| = d_z/2$, а функция F имеет вид

$$\begin{aligned} F^{-}(r) &= e^{-x} \left[C^3 x^2 + (7C^3 + 3C^2)x \right. \\ &\quad \left. + (27c^3 + 15C^2 + 3C) + \frac{P_c}{2} \frac{1}{x} + \frac{P_c}{2} \frac{1}{x^2} \right], \end{aligned} \quad (5)$$

где характеризующие параметры относятся к отрицательной подрешетке.

В работе [5] „доказано“, что усредненный по плоскостям (x, y) потенциал точечной кристаллической решетки равен нулю

$$\left\langle -\sum_{l,m,n} \frac{e}{|\mathbf{r}-\mathbf{L}|} + \sum_{l,m,n} \frac{e}{|\mathbf{r}-\mathbf{L}-\mathbf{\Delta}|} \right\rangle = 0. \quad (6)$$

Эта ошибка, как уже было отмечено, появляется в результате использования модели бесконечного кристалла. Если размеры кристаллов вдоль пролета частицы много меньше, чем ее поперечные размеры (практически интересный случай), то, как было показано в [6,7], вместо (6) имеем

$$\langle \dots \rangle = \frac{2\pi e}{d_0} p(z - 1/4); \quad p = d_z/d_0; \quad 0 \leq z \leq 1/2, \quad (7)$$

где z измерена в единицах d_z .

Усреднение первого слагаемого в (4) удобно провести в полярных координатах

$$\langle F(r) \rangle = \frac{1}{d_0^2} \int_0^{\rho_0} F(r) 2\pi r dr; \quad \rho_0 = d_0/\sqrt{\pi}. \quad (8)$$

Перейдя здесь к интегрированию по переменной $x = [\alpha^2(\rho_0^2 + z^2)]^{1/4}$, для первого слагаемого в (4) находим

$$\begin{aligned} \frac{2eN^{-}\alpha^{-}}{P_c^{-}} \langle F^{-} \rangle &= \frac{2\pi e}{d_0} [\varphi(x_1^{-}) - \varphi(x_2^{-})], \\ x_1^{-} &= \sqrt{\alpha^{-}|z|}, \quad x_2^{-} = \left[\alpha^{-} \sqrt{\rho_0^2 + z^2} \right]^{1/2}, \end{aligned} \quad (9)$$

где все отрезки, кроме d_0 в коэффициенте, измерены в единицах d_z , а функция $\varphi(x)$ имеет вид

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \frac{4N}{P_c \alpha d_0} e^{-x} \\ &\times (A_5 x^5 + A_4 x^4 + A_3 x^3 + A_2 x^2 + A_1 x + A_0), \end{aligned} \quad (10)$$

$$A_5 = C^3; \quad A_4 = 12C^3 + 3C^2;$$

$$A_3 = 75C^3 + 27C^2 + 3C,$$

$$A_2 = 225C^3 + 81C^2 + 9C + P_c/2;$$

$$A_1 = A_0 = 450C^3 + 162C^2 + 18C + 3P_c/2. \quad (11)$$

Таким образом, с учетом (4), (7) и (9), для усредненного вдоль заряженных плоскостей (111) и (111) потенциала получаем

$$\begin{aligned} \langle \varphi_{tot}(z) \rangle &= \langle \varphi_{tot}^{-}(z) \rangle + \langle \varphi_{tot}^{+}(z) \rangle \\ &= \frac{2\pi e}{d_0} \left[\varphi^{+}(x_1^{+}) - \varphi^{+}(x_2^{+}) + \varphi^{-}(x_1^{-}) \right. \\ &\quad \left. - \varphi^{-}(x_2^{-}) + p(z - 1/4) \right]; \end{aligned} \quad (12)$$

$$x_1^{+} = \sqrt{\alpha^{+}|z - 1/2|}, \quad x_2^{+} = \left[\alpha^{+} \sqrt{\rho_0^2 + z^2} \right]^{1/2},$$

а $x_{1,2}^{-}$ — даны в (9).

Для иллюстрации полученных результатов по (12) на рис. 2 приводится график функции потенциальной энергии взаимодействия $U(z) = -e \langle \varphi_{tot}(z) \rangle$ каналированного электрона с гранецентрированным кристаллом KCl. При

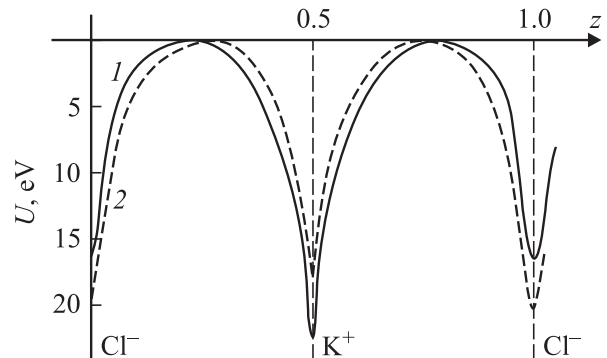


Рис. 2. 1 — на основе формулы (12), 2 — из работы [5].

этом были использованы следующие характеризующие кристалл параметры [9]:

	N	Z	c	ξ
K^+	18	19	0.285	12.04
Cl^-	18	17	0.243	9.76

$$d = 6.290 \text{ \AA}, \quad d_z = 3.632 \text{ \AA}, \quad d_0 = 4.139 \text{ \AA}, \quad p = 0.877, \\ 2\pi e^2/d_0 = 21.86 \text{ eV}.$$

Как видно из рис. 2, глубина потенциальной ямы на плоскостях K^+ равна 22.5 eV, а на плоскостях Cl^- — 16.5 eV, в то время как, согласно работе [5], обе они равны 20 eV.

Список литературы

- [1] Геворкян А.С., Корхмазян Н.Н., Меликян Г.Г. // ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 3. С. 654.
- [2] Корхмазян Н.Н., Меликян Г.Г. // Изв. НАН Армении. Физика. 1993. Т. 28. Вып. 2–3. С. 656.
- [3] Gevorgyan A.S., Grigoryan A.G., Mkrthyan A.R. and Topoyan A.G. // Techn. Phys., 1998. Vol. 43. N 4. P. 452.
- [4] Высоцкий В.И., Кузьмин Р.Н., Максютта Н.В. // ЖЭТФ. 1987. Т. 93. Вып. 6(12). С. 2015.
- [5] Корхмазян Н.А., Корхмазян Н.Н. // НАН Армении. Физика. 1995. Т. 30. Вып. 5. С. 198.
- [6] Корхмазян Н.А., Корхмазян Н.Н., Бабаджанян Н.Э. // ЖТФ. 2003. Т. 73. Вып. 8. С. 1.
- [7] Корхмазян Н.А., Корхмазян Н.Н., Бабаджанян Н.Э. // ЖТФ. 2004. Т. 74. Вып. 12. С. 98.
- [8] Бабаджанян Н.Э. // ЖТФ. 2006. Т. 76. Вып. 3. С. 89.
- [9] Гамбош П. Статическая теория атома и ее применения. М.: ИЛ, 1951. 398 с.